

표면 마이크로 가공기술을 이용한 비냉각 초전형 적외선 검출소자 제작

장철영, 고성용, 이석현, 김동진, *김진섭, **이재신, 이정희, ***한석룡, 이용현
경북대학교, *인제대학교, **울산대학교, ***한국전자
전화 : (053) 950-5520 / 팩스 : (053) 950-5520

Fabrication of Uncooled Pyroelectric Infrared Detector using Surface Micromachining Technology

Chel-Young Jang, Sung-Yong Ko, Suk-Hun Lee, Dong-Jin Kim, *Jin-Sup Kim,
Jae-Shin Lee, Jung-Hee Lee, *Suk-Yong Han and Yong-Hyun Lee
Kyungpook National University, *Inje University, **University of Ulsan,
***Korea Electronics Co. Ltd
E-mail : yhlee@ee.knu.ac.kr

Abstract

Uncooled pyroelectric infrared detectors based on BST($Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$) thin films have been fabricated by RF magnetron sputtering and surface micromachining technology. The detectors form BST thin film ferroelectric capacitors grown by RF magnetron sputtering on N/O/N($Si_3N_4/SiO_2/Si_3N_4$) membrane. The sputtered BST thin film exhibits highly c-axis oriented crystal structure that no poling treatment for sensing applications is required. This is an essential factor to increase the yield for realization of an infrared image sensor. surface-micromachining technology is used to lower the thermal mass of the detector by giving maximum sensor efficiency. Gold-black is evaporated on top of the sensing elements used the thermal evaporator. fabricated uncooled pyroelectric infrared detectors is highly output voltage at the low temperature(1 °C).

I. 서 론

초전 특성을 이용한 열 검지형 적외선 센서는 일반적으로 복사체로부터 방사된 적외선을 츄핑시키고 츄핑된 적외선을 흡수하여 열로 변환시키는 적외선 흡수체, 변환된 열에 의해 저항, 커패시턴스 및 열기전력 등 검지변수의 변화를 발생시키는 검지재료, 적외선 흡수체에 수집된 열의 기판을 통한 손실을 방지하기 위한 열차단막 및 열차단막을 지지하는 기판 등으로 구성된다[1,2].

검지재료와 함께 적외선 흡수체 및 열차단막의 특성이 검지도, 분광 응답도, 열 감응도 및 응답속도 등 열 검지형 적외선 센서의 성능을 결정하는 핵심 요소가 된다. 그러므로 열차단막의 열전도도 및 스트레스 문제를 개선하기 위하여 LPCVD 공정을 이용하여 Si_3N_4 와 SiO_2 를 샌드위치 형태로 증착하여 내재 스트레스가 상쇄되도록 하여야 한다[1,3,4].

적외선 흡수체는 적외선 센서에서 열차단과 더불어 센서의 분광응답 특성을 결정하는 중요한 요소이다. 흡수체의 적외선 흡수도 또는 방출도는 파장에 따라 달라지게 되므로 입사된 적외선에 의해 흡수체에서 변환되는 열량도 파장에 의존하게 되므로, 센서의 적외선 분광응답 특성은 센서에서 사용된 흡수체의 적외선 흡수도 또는 방출도에 의해 크게 좌우된다[5,6].

강자성체의 초전특성을 이용한 상온 동작용 적외선 검지 소자는 주로 8~12 μm 파장의 적외선을 방출하는 인체의 감지를 위한 목적으로 사용되어 왔다. 이는 액체 질소 온도로 냉각할 필요가 없으며 적외선 파장에 대한 의존도가 적은 이점으로 인하여 주로 민수용으로 사용되고 있다[7].

본 연구에서는 높은 적외선 흡수도를 가지는 Au-black과 상온에서 동작이 가능하도록 조성을 맞춘 BST($(\text{Ba}_{0.66}\text{Sr}_{0.34})\text{TiO}_3$) 박막을 표면 마이크로 가공 기술을 이용하여 열 차단을 시킨 적외선 검지 소자를 제작하고, 그 특성을 측정하였다.

II. 적외선 검지 소자 제작

비저항이 5~10 $\Omega \cdot \text{cm}$ 이고 (100)면의 n형 실리콘 웨이퍼에 Ion Implantation을 사용하여 공극(Air-gap)이 형성될 부분만 선택적으로 n^+ 영역을 형성하였다.

검지 소자의 지지를 위해 먼저 poly-Si를 약 700 nm 증착하고 그 위에 150 nm-Si₃N₄ / 300 nm-SiO₂ / 150 nm-Si₃N₄ (N/O/N) 박막을 증착하였다. Si₃N₄ 박막은 780 °C의 고온 LPCVD 장비를 이용하여 290 mTorr의 압력으로 SiH₂Cl₂와 NH₃의 혼합가스를 사용하여 증착하였고, SiO₂ 박막은 440 °C의 저온 LPCVD 방법으로 20 mTorr의 압력하에서 SiH₄, N₂ 및 O₂의 혼합가스를 사용하여 증착하였다.

N/O/N 박막을 RIE를 사용하여 양극반응에 필요한 window를 형성하였다.

하부전극으로는 고주파 마그네트론 스퍼터링 장치를 이용하여 Pt/Ti를 각각 200 nm / 20 nm의 두께로 증착하였으며, Ti는 Pt와 N/O/N 박막 사이의 접착력 개선을 위하여 사용하였다. 증착된 Pt/Ti를 습식식각을 이용하여 패턴을 형성한 후, 양극반응을 위한 뒷면전극으로 Thermal Evaporator를 이용하여 300 nm의 두께로 Aluminum을 증착하였다.

양극 반응은 자체 제작한 장치를 이용하여 2.5 V의 정전압을 15분 동안 인가하여 n^+ 부분을 PSL (Porous Silicon Layer) 형태로 만든 후 5 %wt의 NaOH 용액을 이용하여 공극(Air-gap)을 형성하였다. 이 때 전류 밀도는 약 30 mA/cm²이다.

BST 박막은 Sr 과잉함량이 4 m/o인 ($\text{Ba}_{0.66}\text{Sr}_{0.34}\text{TiO}_3$) 타겟을 고주파 마그네트론 스퍼터링 장치를 사용하여 하부전극 위에 600 °C의 기판온도로 약 1 μm 의 두께로 증착하였고, HF:H₂O=1:10 식각 용액으로 습식 식각하여 패턴을 형성하였다.

상하부 전극사이의 전기적 절연을 위해 SiO₂를 고주

파 마그네트론 스퍼터링 장치를 사용하여 300 nm 증착하였다.

상부전극은 진공 증착기를 사용하여 진공을 깨트리지 않고 약 300 nm 두께로 Au/NiCr을 증착하고, 감광액 lift-off 방법으로 패턴을 형성하였다.

적외선 흡수체로는 넓은 파장범위에 걸쳐 높은 흡수도를 갖는 Au-black을 선택하였다. Au-black은 진공 증착기를 사용하여 N₂ 가스를 잔류기체로 Au를 1 Torr에서 900 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 의 면밀도를 갖도록 증착하여 감광액 lift-off 방법으로 패턴을 형성하였다. 그럼 1에 제작된 검지 소자를 나타내었다.

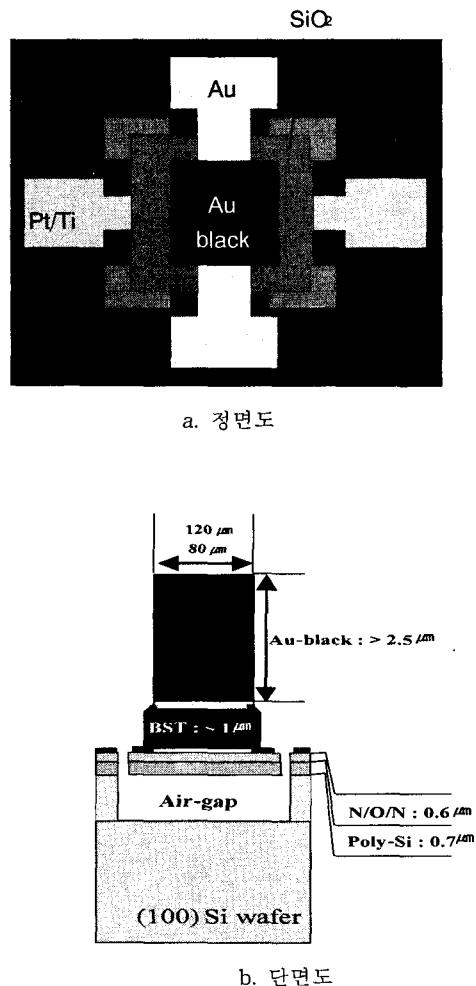


그림 1. 제작된 적외선 검지 소자

III. 적외선 검지 소자의 측정 및 결과

그림 2에는 인가전압이 2.5 V이고, HF:H₂O=1:1의 반응액으로 15 분 동안 양극 반응을 했을 때의 공극(Air-gap)이 형성된 SEM 사진을 나타내었다. 최소한의 열 차단이 되기 위해서는 15분 정도의 반응 시간이 필요하다.



그림 2. 양극반응 후의 단면 SEM 사진

그림 3에는 제작된 검지 소자의 단면 SEM 사진을 나타내었다. 그림 3으로부터 소자 제작공정이 잘 수행되었음을 알 수 있다.

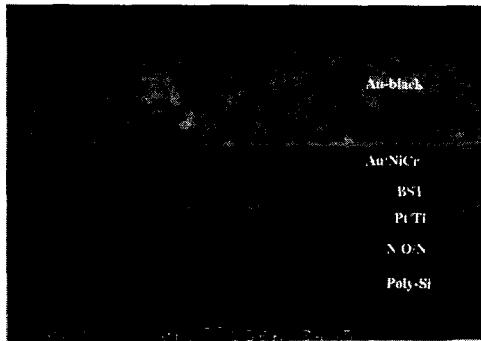


그림 3. 제작된 소자의 단면 SEM 사진

실리콘 표면 마이크로머시닝 방법으로 열차단 된 검지 소자의 누설전류 및 적외선 검지 성능지수를 측정하였다. HP-4145B 반도체 파라미터 분석기를 이용하여 인가전압을 40 V로 하였을 경우, BST 박막의 누설전류는 약 6.0 nA로 우수한 절연특성을 나타내었다. 또 HP-4192 임피던스 분석기를 이용하여 측정한 정전용량은 17.2 pF였다.

제작된 적외선 검지 소자를 그림 4와 같이 자체 제

작한 측정장치를 이용하여 출력 파형을 측정하였다. IR source는 파장이 0.94 μm이고, 단위 면적당 방사에너지가 약 500 mW/cm²인 적외선 방출 다이오드이다. 측정 온도의 범위는 30 °C ~ 1 °C이며, 측정 주파수의 범위는 10 Hz ~ 1 Hz 까지로 하였다. 각 측정 주파수별로 측정온도가 1 °C에서 가장 큰 출력을 나타내었다. 그림 5에 측정온도 1 °C에서 각 측정 주파수에 따른 출력을 나타내었다.

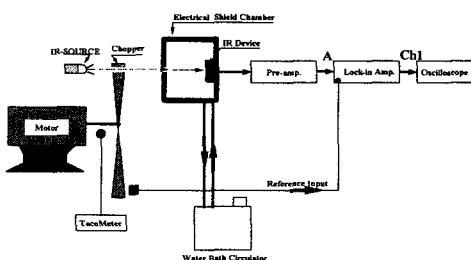


그림 4. 적외선 용답특성 측정 시스템

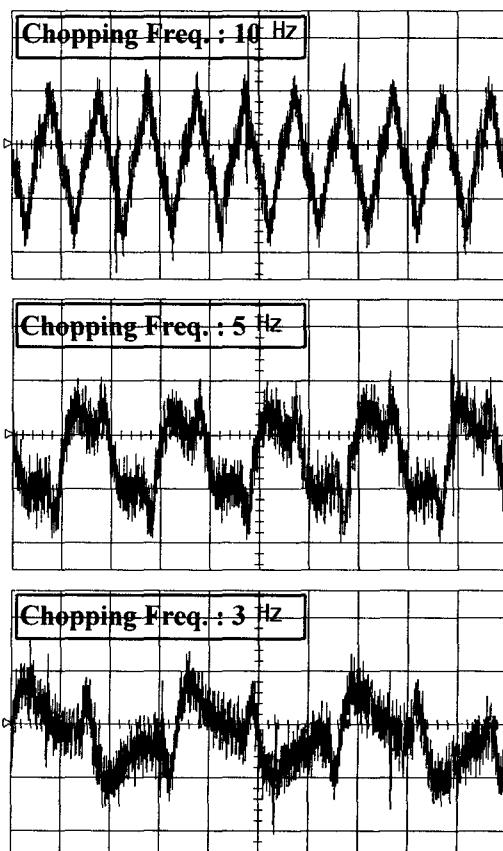


그림 5. 측정온도 1 °C에서 측정 주파수에 따른 출력 파형

IV. 결 론

표면 마이크로 머시닝 방법을 이용하여 초전형 적외선 검지 소자를 제작하고 그 특성을 측정하였다.

N/O/N 박막의 경우 표면 마이크로 머시닝 후에도 박막이 무너지거나 크랙 발생이 전무하였다. 그러므로 강한 전류밀도를 가지고 표면 마이크로 머시닝을 할 경우에 지지대로 N/O/N 박막이 적합함을 알 수 있다.

적외선에 대한 응답특성 측정에서는 검지 소자의 측정 온도를 $30^{\circ}\text{C} \sim 1^{\circ}\text{C}$ 의 범위로 변화시키고, 쇄평 주파수를 10 Hz, 5 Hz 및 3 Hz로 변화시켰을 때, 일정한 온도에서 쇄평 주파수가 감소함에 따라 검지 소자의 출력전압 파형의 첨두치가 약간 증가하였으며, 온도가 감소함에 따라 쇄평 주파수에 따른 출력 전압이 증가하는 변화가 나타났다. 특히 5 Hz 이하의 쇄평 주파수에서 온도가 5°C 이하로 내려감에 따라 출력 전압의 파형이 구형파와 같은 형태로 바뀌는 현상이 나타나는데 이런 현상은 열 잡음의 감소 및 검지 소자의 비교적 큰 열 시정수 때문인 것으로 판단된다. 또한 증착된 BST 박막의 조성이 변화하기 때문이다.

그러므로 본 연구에서 제작된 초전형 적외선 검지 소자를 열 영상 시스템에 적용하기 위해서는 열 시정수를 줄여서 동작속도를 증가시켜야 하고, BST 박막의 조성제어에 대한 연구가 있어야 한다.

감사의 글

본 연구는 민군겸용 기술 개발 사업의 일환으로 한국전자(주)의 연구비 지원에 의해 수행되었음.

참고문헌

- [1] T. Elbel, "Miniaturized thermoelectric radiation sensors," *Sensors and Materials*, Vol. 3, No. 2, pp. 97-109, 1991.
- [2] B. Willing et al., "Gas spectrometry based on pyroelectric thin film arrays integrated on silicon," *Digest of Technical Papers of Transducers '97*, pp. 1245-1248, 1997.
- [3] F. Völklein, "Thermal conductivity and diffusivity of a thin film $\text{SiO}_2\text{-Si}_3\text{N}_4$ sandwich system," *Thin Solid Films*, Vol. 188, pp. 27-33, 1990.
- [4] 김명규 등, "스트레스 균형이 이루어진 $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4$ 유전체 멤버레이의 제작," *센서학회지*, 제4권, 제3호, pp. 51-59, 1995.
- [5] E. L. Dereniak and G. D. Boreman, *Infrared detectors and systems*, A Wiley-Interscience Publication, 1996.
- [6] 오광식 등, "질소가스 분위기의 저진공으로 증착된 Au-black의 적외선 흡수도" *전자공학회논문지*, 제37권, 제2호, pp. 105-113, 2000.
- [7] M. Okuyama et. al., "Basic Characteristics of an Infrared CCD with a Pyroelectric Gate," *Sensors and Actuators*, A21-A23, pp. 465-468, 1990.